

適用規格							
定格	使用温度範囲	-35℃～ + 85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ + 60℃ (注2)			
	電圧	AC 50 V	適合コネクタ	DF17#(**)-*DP-0.5V(57)			
	電流	0.3 A					
性能							
	項目	試験方法	規格			QT	AT
構造	外觀, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。				○	○
電氣的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	60 mΩ以下			○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上			○	—
	耐電圧	AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。 ▲	極数	挿入力 (N)以下	抜去力 (N)以上	○	—
			20	20.0	2.0		
			26	26.0	2.6		
			30	30.0	3.0		
			40	40.0	4.0		
		50	50.0	5.0			
		60	60.0	6.0			
		70	70.0	7.0			
		80	80.0	8.0			
	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗 : 60 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐振性	周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗 : 60 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 250 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 5~35 → 85 → 5~35℃ 時間 30 → 10~15 → 30 → 10~15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗 : 60 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150~180℃ 90~120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田 (リペア) の場合 】 半田ごてで 350℃、3秒の条件にて半田付け を行う。但し、端子に力を加えないこと。	外觀の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。			○	—
	二酸化硫黄	濃度 10ppm、96時間放置する。 (試験規格 : J E I D A - 3 9)	①接触抵抗 : 60 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			○	—
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	①接触抵抗 : 60 mΩ以下 ②はなはだしい腐食がないこと。			○	—
備考							
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。							
(注2) 保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は、使用温度範囲が適用 されます。エンボス梱包仕様時の保存温度範囲には-10~+50℃となります。							
試験規格の記載のない試験方法は J I S C 5 4 0 2を適用している。							
	△の数	訂正記事	設計	検図		年月日	
▲	1	DIS-H-00003088	SH. HOSODA	TS. MIYAZAKI		17. 09. 29	
				承認	KH. IKEDA	05. 08. 26	
				検 図	AR. TAKAHASHI	05. 08. 26	
				担 当	YH. MICHIDA	05. 08. 24	
				製 図	YH. MICHIDA	05. 08. 24	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目			図番	ELC4-162129-07			
HRS	製品規格表		製品名	DF17B(3.0)-*DS-0.5V(57)			
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL683		▲	1/1